



LIB.OVERHANG ANALYSIS

Une avancée majeure dans l'inspection des cellules lithium-ion

Lancement de l'analyse rapide en 3D grâce à une IA pour l'inspection automatisée de cellules lithium-ion.



Nikon Metrology SARL
39 rue du bois chaland
91090 Lisses FRANCE

Sales.France.NM@nikon.com
industry.nikon.com
+33 1 60 86 09 76

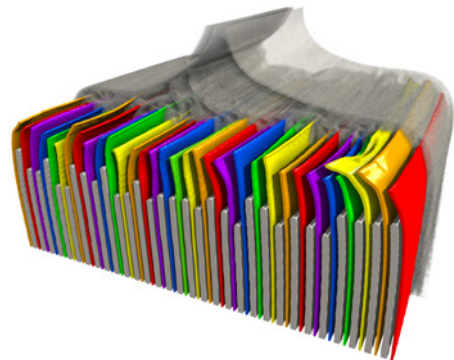
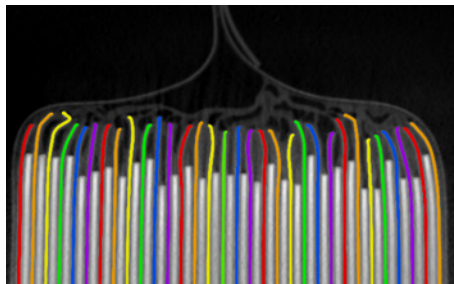
LIB.OVERHANG ANALYSIS

LiB.Overhang Analysis présente **la mesure 3D du recouvrement d'anode** directement en atelier.

A l'aide d'une **IA innovante, d'algorithmes de reconstruction** internes et d'une **technologie avancée de source de rayons X**, le recouvrement d'anode peut désormais être mesuré en 3D plus rapidement et avec davantage de précision qu'auparavant.

PRINCIPAUX AVANTAGES :

- **SOLUTION SYSTÈME DE BOUT EN BOUT**
Configuration logicielle et matérielle optimisée, fondée sur l'expertise de Nikon en Tomographie Numérique (TN)
- **PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE**
Fiabilité de la technologie d'analyse par IA combinée à des scans TN ultra rapides
- **ENTIÈREMENT AUTOMATISÉE**
Analyse automatique du début à la fin sans intervention d'un opérateur
- **CONÇUE POUR LA PRODUCTION**
Résultats pouvant être importés pour interprétation logicielle (format standard) et permettant une intégration dans des systèmes de contrôle de processus
- **OBTENIR UNE IMAGE COMPLÈTE**
Analyse répétée axée sur des données 3D et non uniquement à partir de projections 2D



LiB.Overhang Analysis exporte un large éventail de statistiques pour un verdict automatique et un feedback en circuit fermé sur la chaîne de production. Les experts Nikon apportent une solution de bout en bout en optimisant le système et le logiciel Nikon pour chaque application.

Les Rotating.Target 2.0 et Half-Turn CT, innovations Nikon, fournissent déjà un scan à grande vitesse des batteries au lithium. LiB.Overhang Analysis produit des résultats hautement répétables quels que soient le bruit de mesure typique et les artefacts de scans associés à des acquisitions rapides, ce qui permet de raccourcir encore davantage la durée de cycle. Combiner ces fonctionnalités en un seul système permet de procéder à une analyse automatique des scans en production, solution significativement plus rapide que les méthodes conventionnelles.